07;12 Сверхпроводниковый NBN однофотонный детектор, интегрированный с четвертьволновым резонатором

© Н.Н. Манова, Ю.П. Корнеева, А.А. Корнеев, В. Слыш (W. Slysz), Б.М. Воронов, Г.Н. Гольцман

Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия Institute of Electron Technology, Warsaw, Poland E-mail: nadya@rplab.ru

Поступило в Редакцию 11 января 2011 г.

Исследована спектральная зависимость квантовой эффективности сверхпроводниковых NbN однофотонных детекторов, интегрированных с оптическими четвертьволновыми резонаторами с использованием диэлектриков Si_3N_4 , SiO_2 , SiO.

Для многих научных и технических задач, включая телекоммуникационные и оптические системы, квантовую криптографию и исследования однофотонных источников, необходимы быстрые детекторы, обладающие однофотонной чувствительностью в ИК-диапазоне длин волн. Чувствительность существующих кремниевых лавинных фотодиодов ограничивается шириной запрещенной зоны кремния и резко падает на длинах волн, больших 1.1 µm, делая их непригодными для использования на телекоммуникационных длинах волн 1.3 и 1.55 µm. Коммерчески доступные лавинные фотодиоды на основе InGaAs чувствительны к ИК-излучению вплоть до длины волны 1.8 µm, имеют скорость счета порядка 10 MHz [1], хотя в [2] сообщается о возможности увеличения скорости счета до 2 GHz. Поскольку лавинные фотодиоды имеют высокий уровень ложных срабатываний (10³ s⁻¹), их, как правило, используют в узком временном окне длительностью порядка 1 ns, что оказывается неудобным для ряда применений. Альтернативой полупроводниковым однофотонным детекторам стали сверхпроводниковые детекторы. Квантовая эффективность вольфрамовых детекторов на сверхпроводящих переходах (TES) достигает 90% на длине волны

49

1.55 μ m, рабочий диапазон длин волн простирается до 5 μ m [3]. Но эти приборы очень медленные (максимальная скорость счета 20 kHz), легко насыщаются тепловым фоновым излучением, и для их практического использования требуется охлаждение до 100 mk и сложная схема стабилизации температуры. В 2001 году в [4] был предложен сверхпроводниковый однофотонный детектор (Superconducting single photon detector, SSPD), принцип действия которого основан на возникновении резистивной области в тонкой сверхпроводящей полоске нитрида ниобия при поглощении ею фотона. SSPD демонстрирует гигагерцовую скорость счета и однофотонную чувствительность до 5.6 µm [5]. Квантовая эффективность (отношение числа зарегистрированных фотонов к числу падающих) лучших детекторов достигает 30% на длине волны 1.3 µm и 10% на 1.55 µm при температуре 2 К и уровне ложных срабатываний $10 \, {\rm s}^{-1}$. Благодаря своим характеристикам SSPD уже нашел применение в решении многих научных задач [6-9], однако дальнейшее расширение области практического использования SSPD связано с необходимостью увеличения квантовой эффективности детектора.

Квантовая эффективность SSPD ограничена коэффициентом поглощения тонкой пленки нитрида ниобия, величина которого не превышает 30% [10]. В работе [11] был предложен способ увеличения поглощения тонких металлических пленок путем интегрирования их с оптическим четвертьволновым резонатором. Первые попытки изготовить резонаторы для SSPD были представлены в работах [12–14].

В данной работе мы представляем систематическое исследование квантовой эффективности SSPD, интегрированных с оптическими четвертьволновыми резонаторами, выполненными на основе диэлектриков Si₃N₄, SiO₂, SiO.

В нашем SSPD полоска нитрида ниобия имеет длину 500 μ m, ширину 100 nm и толщину 3.5 nm, формируется на сапфировой подложке в форме меандра, покрывающего площадь $10 \times 10 \,\mu$ m. Технология изготовления SSPD подробно описана в [15]. Оптический резонатор для сверхпроводникового NbN однофотонного детектора в этой работе оптимизировался на телекоммуникационную длину волны 1.55 μ m и состоял из слоя диэлектрика толщиной $\lambda/4$ и металлического зеркала. Диэлектрик и металл наносились сверху рабочего элемента детектора. Диэлектрики SiO₂, SiO осаждались методом электронно-лучевого испарения в установке Evatec BAK501 со скоростью 10 nm/s, Si₃N₄ осаждался из газовой фазы. Толщина диэлектриков подбиралась из



Рис. 1. *а* — схематическое изображение поперечного сечения SSPD, интегрированного с оптическим резонатором; *b* — изображение SSPD, интегрированного с оптическим резонатором, полученное с помощью растрового электронного микроскопа.

расчета максимума поглощения на длине волны $1.55\,\mu$ m и показателя преломления *n*. Толщина Si₃N₄ составила 192 nm, SiO₂ — 268 nm, SiO — 221 nm. Металлическое зеркало было изготовлено из пленки золота толщиной 150–300 nm, методом электронно-лучевого испарения со скоростью 0.5 nm/s. При использовании SiO и SiO₂ оба составляющих слоя резонатора формировались методом обратной электронной литографии; в случае использования Si₃N₄ — методом прямой электронной литографии, что упростило технологию изготовления резонаторов и увеличило выход годных структур. Схематическое изображение поперечного сечения SSPD, интегрированного с оптическим четвертьволновым

резонатором, и его изображение, полученное с помощью растрового электронного микроскопа, представлены на рис. 1. Отметим также, что после нанесения резонатора критическая температура детектора падала не более чем на 1 К, что свидетельствует об отсутствии повреждений пленки нитрида ниобия в процессе изготовления резонатора.

Поскольку измерение квантовой эффективности перед нанесением резонатора приводит к загрязнению поверхности детектора и существенному ухудшению характеристик резонатора, квантовая эффективность детектора до нанесения резонатора не измерялась. Вместо этого измерялись спектральные зависимости квантовой эффективности SSPD, интегрированных с оптическим четвертьволновым резонатором, и сравнивались со спектральной зависимостью квантовой эффективности аналогичных SSPD без резонатора. Измерения проводились в диапазоне длин волн от 0.7 до 1.8 µm, в качестве источника излучения использовался спектрометр ИКС-31. Образец охлаждался в гелиевом криостате до температуры 5К, входное окно криостата совмещалось с выходной щелью спектрометра. Выходная мощность спектрометра измерялась с помощью оптико-акустического преобразователя. Поскольку точное определение числа фотонов, падающих на детектор, в такой постановке эксперимента затруднительно, мы измеряли относительную квантовую эффективность, определяемую формулой:

$$\eta_{(\lambda)} = rac{hcN}{\lambda U(\lambda)},$$

где h — постоянная Планка, c — скорость света, N — число зарегистрированных фотонов в единицу времени, λ — длина волны, $U(\lambda)$ — напряжение на оптико-акустическом преобразователе ОАП-7, пропорциональное выходной мощности спектрометра. На рис. 2, a представлены спектральные зависимости квантовой эффективности SSPD без резонатора и SSPD, интегрированного с резонатором на основе SiO₂. Из графиков хорошо видно изменение спектральной зависимости квантовой эффективности квантовой эффективности детектора с резонатором в сравнении со спектральной зависимостью квантовой эффективности детектора без резонатора, последняя является типичной для всех SSPD. Ярко выраженный минимум квантовой эффективности детектора с резонатором на длине волны 0.89 μ m свидетельствует о деструктивной интерференции в пленке нитрида ниобия.



Рис. 2. *а* — спектральная зависимость квантовой эффективности SSPD (1) и SSPD, интегрированного с резонатором на основе SiO₂ (2); *b* — отношение спектральной зависимости квантовой эффективности SSPD, интегрированного с резонатором $\eta_{\text{SSPD+C}}$ (резонаторы выполнены с использованием SiO (1), Si₃N₄ (2), SiO₂ (3)) к типичной спектральной зависимости квантовой эффективности SSPD.

На рис. 2, *b* приведены отношения спектральных зависимостей квантовой эффективности детекторов с резонаторами $\eta_{\text{SSPD+C}}$ на основе Si₃N₄, SiO₂, SiO к типичной спектральной зависимости квантовой эффективности SSPD без резонатора η_{SSPD} . Для SSPD с резонатором это отношение на длине волны 1.55 μ m превосходит значение на длине волны минимума для SiO в 50, для Si₃N₄ в 30 и для SiO₂ в 15 раз. Мы также оценили добротность резонаторов: она составила 2.4 для резонатора с использованием SiO, 1.87 для резонатора с использованием Si₃N₄ и 1.7 для резонатора на основе SiO₂. Из этих соотношений видно, что максимальное увеличение эффективности достигается при использовании в качестве диэлектрика монооксида кремния. Это, по всей видимости, можно объяснить лучшим контактом диэлектрика с материалом зеркала.

Таким образом, в данной работе изучена квантовая эффективность сверхпроводниковых NbN однофотонных детекторов, интегрированных с резонаторами, на основе диэлектриков Si₃N₄, SiO₂, SiO. Показано, что наиболее перспективным является SiO, как обеспечивающий наибольшее увеличение квантовой эффективности на длине волны $1.55 \,\mu$ m.

Работа была выполнена в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 годы (ШК № П1921, ГК № 02.740.11.0228).

Список литературы

- [1] Bethnune D.S., Navarro M., Risk W.P. // Appl. Opt. 2002. V. 41. P. 1640.
- [2] Yuan Z.L., Sharpe A.W., Dynes J.F., Dixon A.R., Shields A.J. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 96. P. 071101.
- [3] Lita A., Miller A., Nam S. // Optics Express. 2008. V. 16 (5). P. 3032.
- [4] Goltsman G., Okunev O., Chulkova G. et al. // Appl. Phys. Lett. 2001. V. 79.
 P. 705.
- [5] Tarkov M. et al. // Proc. of 17th Int. Symp. on Space Terahertz Technol. 2006. P. 119–122.
- [6] Hadfield R., Habif J., Schlafer J., Schwall R., Nam S.W. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 89. P. 241129.
- [7] Stevens M., Hadfield R., Schwall R., Nam S.W., Mirin R., Gupta J. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 89. P. 031109.
- [8] Chen J., Altepeter J., Medic M., Lee K.F., Gokden B., Hadfield R., Nam S.W., Kumar P. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100 (13). P. 133603.

55

- [9] Halder M., Beveratos A., Gisin N., Scarani V., Simon C., Zbinden H. // Nature Physics. 2007. V. 3. P. 692.
- [10] Born M., Wolf E. // Principals of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference, and Diffraction of Light. 1999. P. 752–758.
- [11] Rosenberg D., Nam S.W., Miller A.J., Salminen A., Grossman E., Schwall R.E., Martinis J.M. // Nuclear instruments and Methods in Physics Research A. 2004.
 V. 520 (1). P. 537–540.
- [12] Vikas Anant, Andrew J. Kerman, Eric A. et al. // Optics Express. 2008. V. 16. N 14. P. 10750.
- [13] Kristine M. Rosfjord, Joel K.W. Yang, Eric A. Dauler et al. // Optics Express. 2006. V. 14. N 2. P. 527.
- [14] Milostnaya I., Korneev A. et al. // J. Physics: Conference Series. 2006. V. 43. P. 1334–1337.
- [15] Gol'tsman G.N., Smirnov K., Kouminov P., Voronov B., Kaurova N., Drakinsky V., Zhang J., Verevkin A., Sobolewski R. // IEEE Trans., Appl. Supercond. 2003. V. 13. P. 192.